

Seminář odd. 26

Tenkých vrstev a nanostruktur

Fyzikální ústav AVČR, Cukrovarnická 10, Praha 6

datum: 13. 10. 2011 čtvrtek

čas: 14:00

mítnost: knihovna, budova A, 1.p.

TÉMA

AFM based characterization of inorganic and organic semiconductor nanostructures

Christian Teichert

Montan University, Leoben, Austria

odborný garant: *RNDr. Antonín Fejfar, Csc.*